

JIS

めっきの厚さ試験方法

JIS H 8501:1999

(2008 確認)

平成 11 年 8 月 20 日 改正

日本工業標準調査会 審議

(日本規格協会 発行)

著作権法により無断での複製、転載等は禁止されております。

まえがき

この規格は、工業標準化法に基づいて、日本工業標準調査会の審議を経て、通商産業大臣が改正した日本工業規格である。これによって、JIS H 8501-1988は改正され、この規格に置き換えられる。

この規格の一部が、技術的性質をもつ特許権、出願公開後の特許出願、実用新案権、又は出願公開後の実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。通商産業大臣及び日本工業標準調査会は、このような技術的性質をもつ特許権、出願公開後の特許出願、実用新案権、又は出願公開後の実用新案登録出願にかかわる確認について、責任をもたない。

JIS H 8501には、次に示す附属書がある。

- 附属書 1 (参考) 渦電流式試験方法の測定上の注意事項
- 附属書 2 (参考) 磁力式試験方法の測定上の注意事項
- 附属書 3 (参考) 蛍光X線式試験方法の測定上の注意事項
- 附属書 4 (参考) β 線式試験方法の測定上の注意事項
- 附属書 5 (参考) 多重干渉式試験方法の測定上の注意事項
- 附属書 6 (参考) 走査電子顕微鏡試験方法の測定上の注意事項

主 務 大 臣：通商産業大臣 制定：昭和 57.11.1 改正：平成 11.8.20

官 報 公 示：平成 11.8.20

原案作成協力者：社団法人 表面技術協会

審 議 部 会：日本工業標準調査会 非鉄金属部会（部会長 神尾 彰彦）

この規格についての意見又は質問は、経済産業省 産業技術環境局標準課 産業基盤標準化推進室（☎100-8901 東京都千代田区霞が関 1 丁目 3 - 1）にご連絡ください。

なお、日本工業規格は、工業標準化法第15条の規定によって、少なくとも 5 年を経過する日までに日本工業標準調査会の審議に付され、速やかに、確認、改正又は廃止されます。

めっきの厚さ試験方法

H 8501:1999

Methods of thickness test for metallic coatings

序文 この規格は、1. 適用範囲の備考に示す対応国際規格を元に、対応する部分についてはこれらの対応国際規格を翻訳し、技術的内容を変更することなく作成した日本工業規格であるが、対応国際規格には規定されていない規定項目を日本工業規格として追加している。

1. 適用範囲 この規格は、金属素地上に施した電気めっき及び化学めっきの厚さ試験方法について規定する。

備考 この規格の対応国際規格を、次に示す。

ISO 1463 : 1982 Metallic and oxide coatings—Measurement of coating thickness—Microscopical method

ISO 2064 : 1996 Metallic and other inorganic coatings—Definitions and conventions concerning the measurement of the thickness

ISO 2177 : 1985 Metallic coatings—Measurement of coating thickness—Coulometric method by anodic dissolution

ISO 2178 : 1982 Non-magnetic coatings on magnetic substrates—Measurement of coating thickness—Magnetic method

ISO 2360 : 1982 Non-conductive coatings on non-magnetic basis metals—Measurement of coating thickness—Eddy current method

ISO 3497 : 1990 Metallic coatings—Measurement of coating thickness—X-ray spectrometric methods

ISO 3543 : 1981 Metallic and non-metallic coatings—Measurement of thickness—Beta backscatter method

ISO 3868 : 1976 Metallic and other non-organic coatings—Measurement of coating thickness—Fizeau multiple-beam interferometry method

ISO 3882 : 1986 Metallic and other non-organic coatings—Review of methods of measurement of thickness

ISO 4518 : 1980 Metallic coatings—Measurement of coating thickness—Profilometric method

ISO 9220 : 1988 Metallic coatings—Measurement of coating thickness—Scanning electron microscope method

2. 引用規格 次に掲げる規格は、この規格に引用されることによって、この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は、その最新版を適用する。

JIS B 0601 表面粗さ—定義及び表示

JIS B 7503 ダイヤルゲージ

JIS B 7519 指針測微器

JIS B 7520 指示マイクロメータ